Pásztázó Elektrokémiai Mikroszkópia továbbfejlesztése korróziós vizsgálatokhoz

Kiss András¹

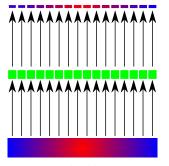
¹Általános és Fizikai Kémia Tanszék Pécsi Tudományegyetem

Mikroszkópos technikák osztályozása

Alapvetően kétféle mikroszkópos technika létezik:

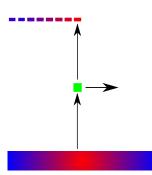
- Pásztázó mikroszkópos technikák
 - Pásztázó alagúthatás mikroszkópia (STM)
 - Pásztázó elektron mikroszkópia (SEM)
 - Pásztázó atomerő mikroszkópia (AFM)
 - Pásztázó elektrokémiai mikroszkópia (SECM)
 - Konfokális mikroszkópia (CLSM)
- Nem pásztázó mikroszkópos technikák
 - Klasszikus optikai mikroszkópia (OM)
 - Transzmissziós elektron mikroszkópia (TEM)

Párhuzamos vs. soros képalkotás



nem pásztázó technika (párhuzamos képalkotás)

kép jel rögzítés érzékelő(k) mintavétel céltárgy



pásztázó technika (soros képalkotás)

Párhuzamos vs. soros képalkotás elemei

Felvétel elkészítéséhez szükséges idő párhuzamos képalkotás esetén:

- 1× egyensúly beállása
- ▶ 1× mintavétel

Felvétel elkészítéséhez szükséges idő soros képalkotás esetén:

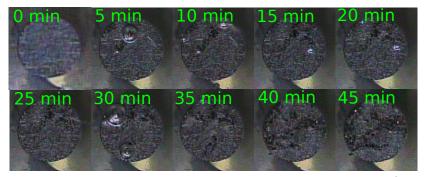
- ► (n-1)× szenzor pozícionálása
- ► (n-1)× egyensúly beállása
- n× mintavétel

ahol n a mintavételi pontok száma.

Párhuzamos vs. soros képalkotás sebessége

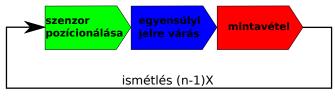
- Optikai mikroszkóp: akár többmillió kép/s. Sebesség független a vizsgált terület nagyságától és a felbontástól.
- Konfokális mikroszkóp: több mint 1000 kép/s. Sebesség függ a vizsgált terület nagyságától, és a felbontástól, de az érzékelő gyorsasága miatt kevésbé limitáló.
- Pásztázó elektrokémiai mikroszkóp: néhány min/kép.
 Pásztázás időtartama egyenesen arányos a mintavételi pontok számával.

AZ63 minta korróziója



AZ63 magnézium-alumínium-cink ötvözet minta korróziója 10^{-3} M NaCl oldatban. A minta átmérője d = 500 μ m. Jelentős változások 5 perc alatt is. A korróziós folyamatok nyomon követéséhez túl lassú a pásztázó elektrokémiai mikroszkóp.

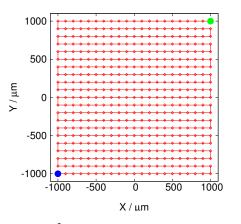
A pásztázáshoz szükséges idő



A pásztázáshoz szükséges idő (t):

- $t = (L/r + 1)^2 \times (r/v + t_e)$
- L: a pásztázási terület szélessége és hosszúsága (μm)
- r: felbontás (μm)
- v: szenzor pozícionálási sebessége (μm/s)
- t_e: egyensúlyi jelre várakozás (s)

A pásztázáshoz szükséges idő



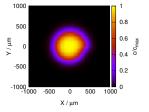
$$t = (L/r + 1)^2 \times (r/v + t_e)$$

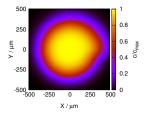
$$t = (2000/100 + 1)(2000/100 + 1) \times (100/1000 + 1)$$

$$t = 485.1s \approx 8min$$

1. A pásztázás területének nagysága

$$t = (L/r + 1)^2 \times (r/v + t_e)$$

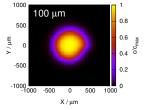


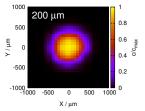


A pásztázási terület negyedére csökkentésével a mintavételi pontok száma is a negyedére csökken, ha a felbontás változatlan.

2. A felbontás csökkentése

$$t = (L/r + 1)^2 \times (r/v + t_e)$$





A felbontás felére csökkentésével a mintavételi pontok száma a negyedére csökken, ha a pásztázási terület változatlan.

3. Pozícionálás gyorsítása

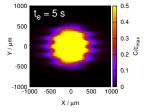
$$t = (L/r + 1)^2 \times (r/\mathbf{v} + t_e)$$

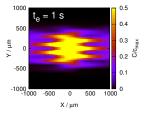
A szenzor pozícionálási sebességének korlátai:

- Műszer specifikáció. A leggyorsabb kereskedelmi készülékek is csak 1000 μm/s maximális sebességre képesek, gyorsulási és lassulási profillal.
- Túl gyors pozícionálás esetén az elektrolit keverése.

4. Egyensúlyi várakozási idő csökkentése

$$t = (L/r + 1)^2 \times (r/v + t_e)$$

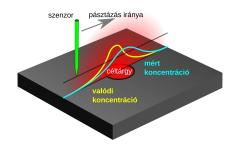


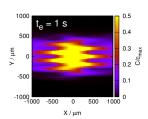


 t_e csökkentésével a pásztázás időtartama csökken, viszont növekszik a pásztázási algoritmusra jellemző torzulás.

A potenciometriás cella válaszideje

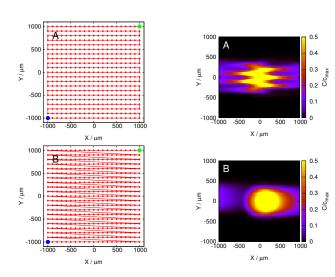
$$E_{cella}(t) = E_{cella}(\infty) + [E_{cella}(0) - E_{cella}(\infty)]e^{-t/RC}$$





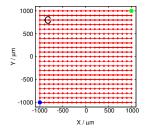
Tradícionális pásztázási algoritmusok

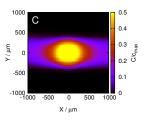
1. "Meander" és "gyors fésű" pásztázási algoritmus



Tradícionális pásztázási algoritmusok

2. "Fésű" pásztázási algoritmus





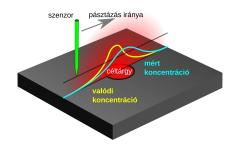
Két új módszer a potenciometriás pásztázó elektrokémiai mikroszkópia gyorsítására

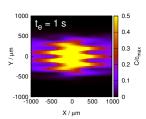
1. Pásztázási algoritmusok optimalizálása.

2. Jelfeldolgozás.

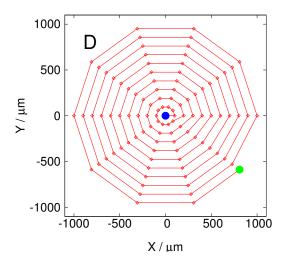
A potenciometriás cella válaszideje

$$E_{cella}(t) = E_{cella}(\infty) + [E_{cella}(0) - E_{cella}(\infty)]e^{-t/RC}$$



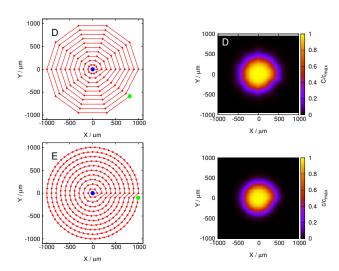


Új, polárkoordináta-rendszer alapú pásztázási algoritmusok



Új, polárkoordináta-rendszer alapú pásztázási algoritmusok

"Pókháló" és "körívmenti" pásztázási algoritmus



Pásztázási algoritmusok

A pásztázási algoritmusok teljesítményének összehasonlítása

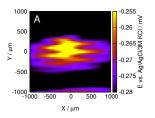
Szimuláció paraméterei:

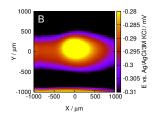
- \blacktriangleright 2000 $\mu m \times$ 2000 μm terület,
- 100 μm × 100 μm felbontás,
- Egy mérési pontra 1 s, felosztva a pozícionálás és az egyensúlyra várás között,
- 500 μm/s pozícionálási sebesség.

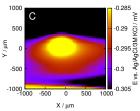
Algoritmus	n	idő (s)	hibanégyzet átlaga
Meander	441	440	2.75×10^{-2}
Gy. fésű	441	520	2.07×10^{-2}
Fésű	441	881	2.75×10^{-2}
Pókháló	110	109	$9.63 imes 10^{-3}$
Körív	341	340	2.95×10^{-3}

Kísérletes PEKM pásztázások

Tradícionális pásztázási algoritmusok





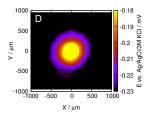


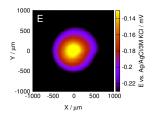
(A) Meander, (B) gyors fésű, (C) fésű pásztázási algoritmusokkal készült felvételek.



Kísérletes PEKM pásztázások

Új, polár-koordináta alapú pásztázási algoritmusok





(C) Pókháló, és (D) Körív pásztázási algoritmussal készült képek.

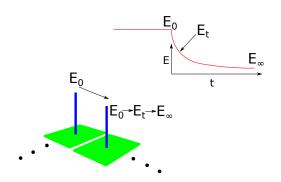
A pásztázási algoritmusok teljesítményének összehasonlítása

Algoritmus	n	idő (s)	hibanégyzet átlaga
Meander	441	440	2.75×10^{-2}
Gy. fésű	441	520	2.07×10^{-2}
Fésű	441	881	2.75×10^{-2}
Pókháló	110	109	9.63×10^{-3}
Körív	341	340	2.95×10^{-3}

- A két új algoritmus rövidebb idő alatt végez a pásztázással.
- A két új algoritmus kevésbé torzult képet eredményez (Körív kb. 10x).
- A pásztázás a legfontosabb rész felől a kevésbé fontos részek felé halad.
- Csak körszimmetrikus céltárgyak esetén működik!



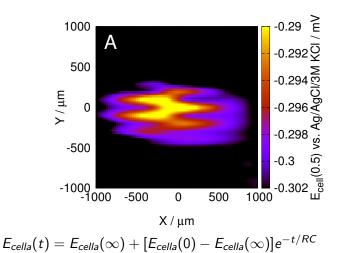
Jelfeldolgozás a potenciometriás pásztázó elektrokémiai mikroszkópiában



$$E_{cella}(t) = E_{cella}(\infty) + [E_{cella}(0) - E_{cella}(\infty)]e^{-t/RC}$$

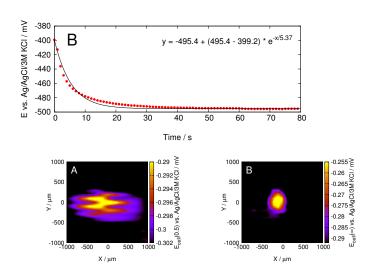
$$E_{cella}(\infty) = rac{E_{cella}(t) - E_{cella}(0)e^{-t/RC}}{1 - e^{-t/RC}}$$

Jelfeldolgozás a potenciometriás pásztázó elektrokémiai mikroszkópiában





Jelfeldolgozás a potenciometriás pásztázó elektrokémiai mikroszkópiában



Köszönöm a figyelmet!